

**FORMULE ASSEGNAZIONI PUNTEGGI****CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI MISURABILI**

1.	Caratteristiche colonna elettronica	Unità di misura	Prestazione base (P <sub>base</sub> )	Prestazione migliore (P <sub>best</sub> )	Coefficiente (C)	Peso (W)	Punteggio (TS)
1.1	Risoluzione (R) @15kV	nm	0,9	Miglior offerta (minima)	$\frac{P_{base} - P_{eff}}{P_{base} - P_{best}}$	<b>3</b>	$C \cdot W$
1.2	Risoluzione (R) @1kV senza bias al campione	nm	1,2	Miglior offerta (minima)	$\frac{P_{base} - P_{eff}}{P_{base} - P_{best}}$	<b>3</b>	$C \cdot W$
1.3	Risoluzione (R) @ 15kV e 5-7 nA alla WD analitica	nm	3.0	Miglior offerta (minima)	$\frac{P_{base} - P_{eff}}{P_{base} - P_{best}}$	<b>3</b>	$C \cdot W$
1.4	Campo visivo alla WD analitica	mm	3	Miglior offerta (massima)	$\frac{P_{eff} - P_{base}}{P_{best} - P_{base}}$	<b>3</b>	$C \cdot W$
2.	Tavolino portacampione	Unità di misura	Prestazione base (P <sub>base</sub> )	Prestazione migliore (P <sub>best</sub> )	Coefficiente (C)	Peso (W)	Punteggio (TS)
2.1	Escursione su asse X	mm	110	Miglior offerta (massima)	$\frac{P_{eff} - P_{base}}{P_{best} - P_{base}}$	<b>1</b>	$C \cdot W$
2.2	Escursione su asse Y	mm	80	Miglior offerta (massima)	$\frac{P_{eff} - P_{base}}{P_{best} - P_{base}}$	<b>1</b>	$C \cdot W$
2.3	Escursione su asse Z	mm	40	Miglior offerta (massima)	$\frac{P_{eff} - P_{base}}{P_{best} - P_{base}}$	<b>3</b>	$C \cdot W$
3.	Camera di lavoro	Unità di misura	Prestazione base (P <sub>base</sub> )	Prestazione migliore (P <sub>best</sub> )	Coefficiente (C)	Peso (W)	Punteggio (TS)
3.1	Diametro	mm	120	Miglior offerta (massima)	$\frac{P_{eff} - P_{base}}{P_{best} - P_{base}}$	<b>2</b>	$C \cdot W$
3.2	Altezza	mm	45	Miglior offerta (massima)	$\frac{P_{eff} - P_{base}}{P_{best} - P_{base}}$	<b>3</b>	$C \cdot W$

CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI NON MISURABILI

4.	Caratteristiche colonna elettronica	prestazioni	Punteggio (TS)
4.1	Sistema di decelerazione degli elettroni	Con applicazione di bias elettrico a stage/campione	1
		Sistema integrato in colonna	2
		Sistema integrato in colonna e bias elettrico	3
5.	Caratteristiche del rivelatore per microanalisi (EDS)	prestazione	Punteggio (TS)
5.1	Large Area Mapping	<p>Possibilità di analisi su grandi aree (Large Area Mapping), automatizzando senza intervento dell'operatore i movimenti dello stage del SEM per realizzare mappe di grandi dimensioni o differenti mappe su zone distinte del campione, programmabili.</p> <p>Il software deve poter incollare in maniera automatica le varie immagini al fine di ricostruire una mappa in un unico file.</p> <p>Deve essere integrabile con il Particle Analysis richiesto nei requisiti minimi, al fine di poter effettuare una analisi di particelle in maniera automatica su porzioni di campione più grandi del singolo frame</p>	20
6.	Caratteristiche del rivelatore per diffrazione di elettroni retrodiffusi (EBSD)	prestazione	Punteggio (TS)
6.1	Software per l'identificazione dei pattern tramite simulazione	<p>Software per l'identificazione dei pattern tramite simulazione (e.g. dynamic simulation/ template matching/ pattern matching).</p> <p>Il software deve consentire la simulazione e quindi il riconoscimento dei pattern di diffrazione tramite la teoria dinamica della diffrazione elettronica, utilizzando sia posizione che intensità delle bande di Kikuchi.</p>	25

N.B: le caratteristiche tecniche non misurabili sono facoltative, la mancanza di offerta di queste caratteristiche non comporterà esclusione dalla gara e assegnerà 0 (zero) punti per fattore tecnico alla caratteristica.